

## ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Κώστας Γιαννακόπουλος είναι απόφοιτος του Τμ. Φυσικής του Α.Π.Θ. (1995), όπου ξεκίνησε την ενασχόληση του με την Επιστήμη των Υλικών και ιδιαίτερα την Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM). Πήρε το Διδακτορικό του από το Πολυτεχνικό Τμήμα (τομέας Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών) του Πανεπιστημίου του Liverpool (Αγγλία) το 1998, με την μελέτη της ανάπτυξης και των δομικών ιδιοτήτων υμενίων InGaAs πάνω σε «γειτονικά» (vicinal) υποστρώματα GaAs. Στη συνέχεια εργάστηκε στο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της μεγαλύτερης Ευρωπαϊκής εταιρείας ημιαγωγών, ST Microelectronics, στην Grenoble της Γαλλίας. Από το 2002 έως σήμερα εργάζεται σαν Προσκεκλημένος Ερευνητής στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», συνεχίζοντας την στενή συνεργασία του με την ST Microelectronics για τον χαρακτηρισμό με Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας TEM νανοϋλικών, όπως μονωτικά λεπτά υμένα με υψηλή διηλεκτρική σταθερά και κβαντικές τελείες ημιαγωγών. Ασχολείται με τον δομικό χαρακτηρισμό και την ανάπτυξη νανοδομών για ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών, όπως: μνήμες flash, μαγνητικές μνήμες, αισθητήρες κλπ. Παράλληλα διδάσκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Πειραιά. Κατά περιόδους έχει επίσης εργαστεί σαν κριτής προτάσεων χρηματοδότησης από την Ε.Ε. και την Ελληνική Κυβέρνηση και έχει γίνει αποδέκτης 3 ερευνητικών υποτροφιών (2 Marie Curie). Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε 35 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.

## C.V. IN BRIEF

Kostas Giannakopoulos graduated from the Physics Dept. of the Aristotle Univ. of Thessaloniki in 1995; during his undergraduate studies he worked for the first time in the fields of Materials Science and Transmission Electron Microscopy (TEM). He took his PhD in 1998 from the Dept. of Engineering (Div. of Materials Sc. and Eng.) of the Univ. of Liverpool (UK), for the study of the growth and the structural properties of InGaAs layers grown on vicinal GaAs wafers. Then he worked at the Central R&D facility of ST Microelectronics (Grenoble, France), the largest semiconductor manufacturer in Europe. Since 2002 he works as an invited researcher in the Electron Microscopy Laboratory of NCSR Demokritos, in Athens, continuing his close collaboration with ST Microelectronics, for the structural characterisation with High Resolution TEM of nanomaterials such as high-k dielectric thin films and semiconductor quantum dots. His research activities include the growth and structural characterisation of nanostructures for a variety of applications such as magnetic memories, flash memories, sensors etc. In parallel he teaches at the National Technical University of Athens and the Technological Educational Institute of Piraeus. He has worked as an expert evaluator of research proposals for the E.U. and the Greek Government and he has received 3 research fellowships (incl. 2 Marie Curie). He has 35 publications in International Journals.